

Приложение № 1

к Договору № 1-22-08/19 от «22» августа 2019

на оказание услуг/выполнение работ
с использованием научного оборудования
ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов
и конденсированных сред»

Прейскурант

Стоимость типовых услуг ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и
конденсированных сред» на 2022 год.

№	Услуга	Цена с НДС 20%, руб. в час	Минимальное число часов по технологии
1	Спектроскопия Мандельштама-Бриллюэна для конденсированных сред	330	8
2	Определение колебательного спектра исследуемого вещества	371	8
3	Измерение КРС при возбуждении ИК-лазером	687	8
4	Спектроскопия низкочастотного комбинационного рассеяния света для конденсированных сред	687	8
5	Люминесцентная спектроскопия	371	8
6	Спектрофлуориметрия жидкостей, твердых тел, порошков	371	8
7	Измерение спектров пропускания конденсированных сред в среднем ИК диапазоне	333	8
8	Нестационарная терагерцовая спектроскопия и диагностика	554	8
9	Измерение оптического спектра волоконных источников света	339	8
10	Измерение пространственных и мощностных характеристик световых пучков	339	8
11	Прецизионное измерение длины волны лазерного излучения в видимом диапазоне и ближнем ИК диапазоне	339	8
12	Измерение характеристик фемтосекундных световых импульсов	339	8
13	Измерение характеристик электрических импульсов	339	8
14	Напыление металлических пленок на подготовленную Заказчиком подложку размером до 153 мм.	488	8
15	Напыление однослойных тонкопленочных покрытий на подготовленную Заказчиком подложку диаметром до 30 мм.	488	8
16	Изготовление микроструктурированных оптических элементов на металлической пленке, напыленной на подложку. Напыленная подложка предоставляется Заказчиком. Размер светового поля элемента – до 50 мм. Проект готовится Исполнителем по фазовой функции	1357	16

	элемента предоставленной Заказчиком. Минимальный размер микроэлементов – 1.5 мкм.		
17	Контроль спектрального распределения коэффициентов отражения / пропускания диэлектрических слоев при вакуумном нанесении многослойного покрытия	355	8
18	Измерения дефектности и упорядоченности периодических поверхностных структур по анализу их СЭМ и АСМ изображений	334	8
19	Измерение оптических и диэлектрических свойств образцов жидкостей методом импульсной терагерцовой спектроскопии	554	8
20	Измерение оптических и диэлектрических свойств тонких пленок в терагерцовом диапазоне	554	8
21	Измерение параметров волоконно-оптических ответвителей	476	8
22	Определение упругого модуля вещества методом рассеяния Мандельштама - Бриллюэна	334	8
23	Измерение спектров комбинационного рассеяния света на спектрометре Trivista 777	687	8
24	Измерение толщины и показателя преломления тонких пленок в видимой и ближней ИК области спектра	409	8
25	Оптические измерения с использованием компактного вакуумного криостата	334	8
26	Определение химического состава микрообразцов по К-, L- эмиссионным спектрам химических элементов	409	2
27	Измерение параметров отклонений формы плоских оптических поверхностей размером до 100 мм с применением интерферометра лазерного ФТИ	358	8
28	Измерения степени гидратации фосфолипидных мембран методом измерения спектров поглощения в ближнем и среднем ИК диапазоне	333	8
29	Измерение параметров волоконных брэгговских решеток	476	8
30	Измерение параметров отклонений формы выпуклых сферических поверхностей размером до 90 мм и вогнутых сферических поверхностей до 300 мм с применением интерферометра лазерного ФТИ	358	8
31	Формирование микрорельефа на подложках из плавленного кварца с помощью установки плазмохимического реактивно-ионного травления с источником высокоплотной плазмы «ПЛАЗМА ТМ 200-01»	955	8

Руководитель ЦКП

 В.П. Корольков